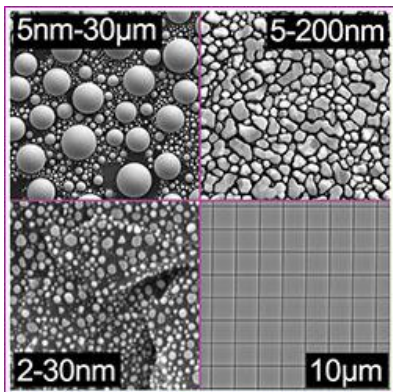


## EM-Tec マルチ標準サンプル

### イントロダクション

EM-Tec のマルチおよびコンビネーションスタンダードは、最大 3 種類の標準サンプルと、10 $\mu$ m のキャリブレーションパターンを SEM スタブ上に載せて提供します。異なる規格の標準サンプルの組み合わせにより、異なるスケールの規格を迅速に同じスタブ上で移行することができます。複数の SEM 標準サンプルの組合せは、複数の SEM をお持ちのユーザーが、SEM の性能を迅速に評価するのに理想的な標準サンプルです。

10 $\mu$ m シリコングリッド上の Sn 球とのコンビネーション標準サンプルは、卓上 SEM の較正に特にお勧めです。



マルチ(4 種)標準サンプルは C 上の 5nm-30 $\mu$ m の Sn、粒径 5-200nm の Au、粒径 3-50nm、および 10 $\mu$ m Si グリッドの 4 種類の標準サンプルで構成されています。

標準 SEM および FESEM での非点収差、解像度およびグレーレベルの低倍率から高倍率のチェックに適しています。

### EM-Tec M4-4 マルチ(4 種)標準サンプル (Sn on C + Au on C + hires Au on C +10 $\mu$ m Si グリッド)

パーツ番号	数量	内容 (取付けスタブ)	価格
31-023404-1	1 個	Ø12.7mm ピンスタブ	¥136,900
31-023404-6	1 個	Ø12.2mm J スタブ	¥136,900
31-023404-8	1 個	Ø15mm M4 スタブ	¥136,900

その他 6 種類の EM-Tec マルチ標準サンプルを用意しています。組合せにつきましては別途ご相談下さい。

パーツ番号	品名	分解能テスト標準サンプル			校正標準サンプル
		Au on C	高面分解能 Au on C	Sn on C	M-10 10 $\mu$ m グリッド
31-023102	EM-Tec M1-2	○	○	—	—
31-023202	EM-Tec M2-2	○	—	○	—
31-023303	EM-Tec M3-3	○	○	○	—
31-023404	EM-Tec M4-4	○	○	○	○
31-023502	EM-Tec M5-3	○	—	○	○
31-023602	EM-Tec M6-2	—	—	○	○

備考：本内容は予告なしに変更されることがございます。